

امکان به کارگیری نanolوله کربنی تک دیواره به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی

شیما رسولیⁱ; علی بهاریⁱⁱ

چکیده

مسیر رو به جلو در کاربرد نanolوله های تک دیواره کربنی به عنوان یک کانال ماسفت (ترانزیستور اثر میدانی فلز- اکسید- نیمه رسانا) برای تراشه ها و نانو ترانزیستورهای آتی به قوی تر و مستحکم تر بودن ساختار آن ها نسبت به ساختار کانال فعلی این ترانزیستورها پیوند خورده است. بر این اساس آزمایش هایی در رشد گیت اکسید سیلیکون فرا نازک بر زیر لایه Si(111) انجام گردید و آنکاه به مطالعه ساختار نanolوله تک دیواره کربنی پرداخته تا روشن شود که آیا این ماده می تواند یک کانال خوب برای تولیدات آتی ترانزیستور ماسفت باشد؟ طیف ها پیش تر با تابش سینکروتونی گرفته شده است. در کار حاضر با مدل هم ارزی- انرژی، مدول یانگ نanolوله تک دیواره آرمچیر و زیگزاگ محاسبه شده و بستگی آن با طول و قطر لوله مشخص شده است که نوع آرمچیر نanolوله کربنی استحکام بیشتری از خود نشان می دهد که برای هدف این مقاله مناسب تر است.

کلمات کلیدی

نانو ترانزیستور، کانال، نanolوله تک دیواره کربنی، مدول یانگ، فشار خارجی، انرژی کرنش.

The Single Wall Carbon Nanotube Ability in Metal-Oxide-Semiconductor Nanotransistor's Channel

Sh. Rasuli; Dr. A. Bahari

ABSTRACT

The ongoing race to use single wall carbon nanotubes as a channel of the Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor in future computer chips and nanotransistor has led to a search for channels with stronger structure than current channel in CMOS.

We have thus demonstrated a series of experiments to grow ultra thin oxide on Si(111) substrate and studied single wall carbon nanotube (SWCNT) structure to set if SWCNT can be a good candidate for future CMOS generation.

The spectra and image have been taken with synchrotron radiation technique. In the present work with an energy-equivalent model we could calculate Young Modulus and show relation between Young modulus with length and diameter of tube. This work shows that armchair type of single wall carbon nanotube is stronger and can fill this gap.

KEYWORDS

Nanotransistor, Channel, Single Wall Carbon Nanotube (SWCNT), Young Modulus, External Pressure, Strain Energy

ⁱ. کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد - دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک، بابلسر

ⁱⁱ. دکترا نانوتکنولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران - گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه- بابلسر- E.mail: a.bahari@umz.ac.ir



پیوستار طبقه‌بندی می‌شوند.

در تئوری مکانیک مولکولی ساختار نanolوله را به صورت مولکول های کربن و پیوندهای بین آن ها در نظر گرفته و انرژی پتانسیل ماده از روی این ساختار مولکولی تعیین می‌شود. درحالیکه در مدل مکانیک پیوستار Nanololle به صورت یک استوانه در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط مسئله، استوانه توپر یا توخالی، باضخامت یا بدون ضخامت در نظر گرفته می‌شود. از شاخه‌های این دوگروه اصلی می‌توان به دینامیک مولکولی، روش کوانتمی $ab initio$ ، تئوری پوسته و تئوری اجزای محدود اشاره کرد.

در این مقاله ابتدا به بررسی ساختار اکسید سیلیکون فوق نازک پرداخته شده و سپس از یک روش معادلسازی انرژی استفاده شده است. به این صورت که ابتدا مدل Mولکولی Nanololle کربنی در نظر گرفته شده و انرژی پتانسیل نهایی ساختار Mولکولی آن به دست آمد. پس از آن Nanololle به صورت یک ساختار بهم‌پیوسته استوانه‌ای شکل فرض شد و انرژی کرنش این ساختار محاسبه شده است. در پایان از برابر قرار دادن انرژی پتانسیل Mولکولی و انرژی کرنش Nanololle کربنی در این دو حالت، مدول یانگ لوله تحت فشار خارجی محیطی محاسبه شده است.

۲- شرح آزمایش

نمونه‌های سیلیکون را از ورقه‌های Si(111) (نوع n، مقاومت ویژه ۵ اهم- سانتیمتر، قطر ۲ میلیمتر) به اندازه $10 \times 10 \times 5$ میلیمترمربع بريده شده‌اند و در بشر حاوی اتانول گذاشته و به مدت یک ساعت، وارد حمام فراصوت گردید تا نمونه‌های تمیز به دست آید. سپس آن را وارد محفظه فرا خلاً کرده و با عبور سریع چندین باره جریان از سینکروترون (برای جزئیات بیشتر رجوع گرفته شده از سینکروترون) در شکل (۱) نشان دهنده وجود تنها حالت های سطح و حالت های تنها توده سیلیکون است و هیچ آلودگی و ناخالصی را نشان نمی‌دهد. آنچه از طیف شکل (۱) بدست می‌آید، وجود ساختار تمیز سیلیکون است که به عنوان یک زیرلایه مناسب در Nanotransistorهای اثر میدانی به کار آمده است.

از زمان کشف Nanololle های کربنی تا امروز زمان زیادی نمی‌گذرد اما تحقیقات گسترده محققان در زمینه‌های مختلف روی این ماده جدید نشان از کاربردهای گوناگون این ماده دارد. خواص گوناگون این ماده از جمله خواص مکانیکی و الکتریکی آن بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. Nanololle های کربنی خواص رسانایی و نیمه رسانایی بسیار خوبی از خود نشان می‌دهند. خاصیت رسانایی Nanololle کربن تا شش برابر مس هم گزارش شده است.

رسانایی خوب Nanololle های کربنی تک دیواره سبب شده که به عنوان ماده جایگزین در بسیاری از قطعات الکترونیکی که وظیفه حمل جریان الکتریکی را بر عده دارند کاربرد داشته باشد. گروه پژوهشی و مولفین مقاله در حال حاضر بر Nanotransistorها تمرکز نموده و با توجه به موانع و مشکلاتی که با کوچک شدگی سریع Nanotransistorهای کربنی پیش آمده است [۱] و [۲]. به مطالعه ویژگی های مواد تشکیل دهنده‌ی یک Nanotransistor اثربخشی از جمله گیت و کانال آن می‌پردازد تا امکان استفاده از آنها را در تولیدات آتی Nanotransistorهای CMOS بررسی کند. چندی پیش نشان داده شده [۳] که Nanotransistorهایی با گیتها دوتایی به جای تک گیتی برتری هایی دارند که از جمله آنها کاهش جریان نشتی در گیت اکسیدهای فوق نازک است [۲] و [۳] و [۴]. اما مشکل بزرگی که همچنان وجود دارد، عبور حامل ها از کانال است که تحرک پذیری و محدودیت حرکت آنها باعث معرفی Nanololle کربنی شده است [۱].

از آنجا که اگر Nanololle کربنی بخواهد در کانال یک Nanotransistor قرار گیرد، تحت تأثیر فشارهای خارجی خواهد بود و این فشارهای خارجی ممکن است باعث خم شدن، شکستن و یا تغییر ساختار لوله شود و به دلیل اهمیتی که ساختار در خواص Rسانایی Nanololle های کربنی در برابر فشار خارجی بسیار مهم است. برای این منظور به بررسی مدول یانگ پرداخته شد که از جمله عوامل مهم در تعیین خواص مکانیکی یک ماده است. برای Nanololle های کربنی مدول های یانگ مختلفی گزارش شده است. این مقادیر از روش های گوناگون نظری و تجربی به دست آمده‌اند که به دلیل دقیق نبودن وسائل و دستگاههای مورد استفاده در مقیاس نانو تا کنون نتایج تجربی یکیگر را تأیید نکرده‌اند [۵] و [۶]. در بیشتر موارد، مدول یانگ از روش های محاسباتی محض به دست آمده‌اند که به دو گروه اصلی Mکانیک Mولکولی و Mکانیک

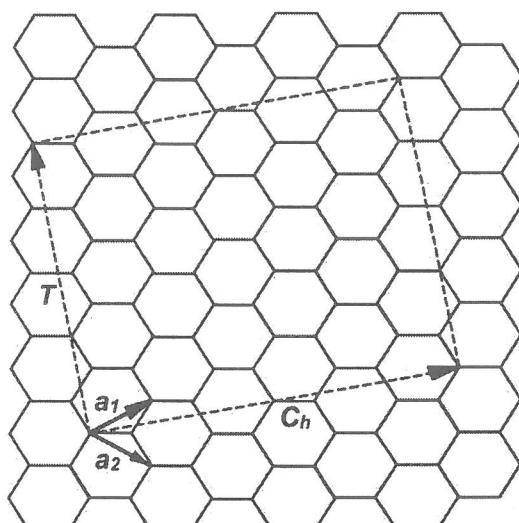
دیده می شود که سیلیکون رشد یافته روی نانو اکسید سیلیکون، ساختاری بی شکل دارد و می تواند به دلیل جلوگیری از جریان نشتی و توزیع زنی همچنان به عنوان گیت به کار رود اما وقتی ضخامت آن بسیار کاوش می یابد و به زیر یک نانومتر می رسد، آنگاه در درجه اول باید به سراغ کانال ترانزیستوری رفت و سپس در پی ماده دی الکتریک مناسب بود. برای کانال عبوری حاملها، نانولوله کربنی پیشنهاد شده است. پس به مطالعه نظری ساختار نانولوله کربنی پرداخته تا روشش شود که کدام نوع نانولوله کربنی (آرمچیر یا زیگزاگ) و با چه قطری قابلیت آن را دارند تا به عنوان یک کانال به کار روند. بنا بر این ماده یعنی مدلول یانگ پرداخته می شود.

۳- نانولوله کربنی

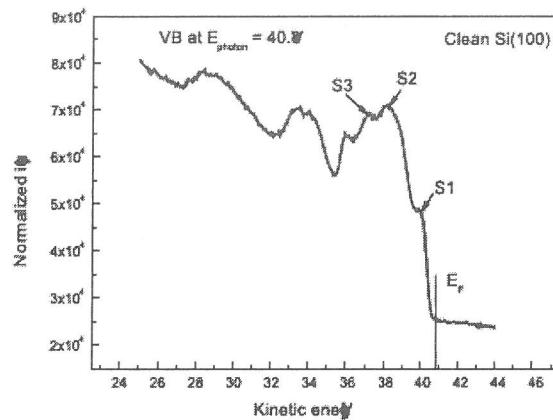
نانولوله های کربنی از یک صفحه گرافن لوله شده درست می شود. گرافن متشکل از یک شبکه اتم های کربن است که در یک ساختار شش ضلعی روی یک صفحه کتانرهم قرار گرفته اند. دو عدد صحیح m تام مشخصه های یک نانولوله تک دیواره کربنی را بیان می کنند. با این دو عدد بردار کایرال صفحه گرافن بوجود می آید که \hat{a}_1 و \hat{a}_2 بردارهای واحد شبکه گرافن هستند.
شکل (۳).

$$C_h = n\hat{a}_1 + m\hat{a}_2$$

اگر روی صفحه گرافن مستطیلی جدا شود به گونه ای که طول مستطیل باشد، با لوله کردن این مستطیل گرافنی در جهتی که C_h محیط استوانه باشد، یک نانولوله تک دیواره به دست خواهد آمد.

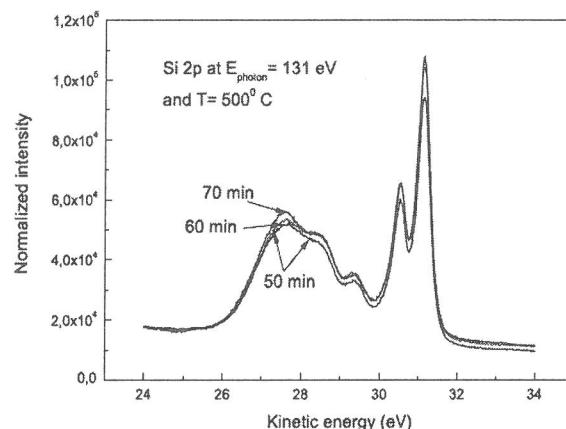


شکل (۳): صفحه گرافن با بردارهای مشخصه نانولوله



شکل (۱): طیف نوار ظرفیت که با انرژی ۴۰/۸ الکترون ولت فوتون ورودی به وسیله تابش سینکروtronی به دست آمده است. S_1 و S_2 و S_3 حالت های تمیز سطح سیلیکون تمیز را نشان می دهند.

بر زیر لایه مذبور، مولکول های اکسیژن به رو شی که شرح آن می آید تابانده می شوند که طیف $Si\ 2p$ گرفته شده از تابش سینکروtronی در شکل (۲) بیان می کند که پیوندهای جالب و مطلوبی بین اتم های سیلیکون و مولکول های اکسیژن در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد شکل گرفته و جابجایی طیف ها به سمت انرژی جنبشی - انرژی بستگی می توان جابجایی به سمت انرژی بستگی بالاتر را دلالت بر پیوندهای تشکیل شده Si و O_2 داشت که کاهش شدت قله های $Si\ 2p_{1/2}$ و $Si\ 2p_{3/2}$ در شکل (۲) مؤید این برداشت است. شایان گفتن است که مولکول های O_2 به خوبی قادرند با سیلیکون تشکیل پیوند دهند و فیلم اکسید سیلیکون را شکل دهند.



شکل (۲): طیف $Si\ 2p$ اکسید سیلیکون که توسط سینکروtron با انرژی فوتون فروند ۱۳۱ الکترون ولت و در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد گرفته شده است.

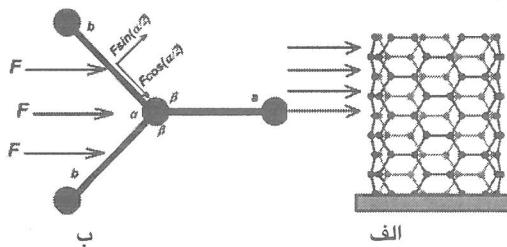
$$U_{tot} = U_b + U_\theta + U_\omega + U_\tau + U_{vdw} + U_e$$

که U_b انرژی کشش پیوندی، U_θ انرژی تغییر زاویه پیوندی، U_ω انرژی چرخشی پیوندها، U_τ انرژی پیچشی پیوندهای کربن-کربن است. U_{vdw} انرژی واندروالس بین اتم های کربن و U_e انرژی الکترواستاتیک بین آن ها است. با توجه به اینکه می توان از اثر ناچیز انرژی های پیوندی U_b و U_θ و غیرپیوندی U_{vdw} چشم پوشی کرد [۶] و [۷]. در محاسبات این مقاله تنها از دو انرژی کشش پیوند و تغییر زاویه پیوندی، آن هم از نوع نوسانگر هماهنگ ساده، استفاده شده است.

$$U_{tot} = U_b + U_\theta$$

۴-۱- نanolوله تک دیواره آرمچیر

شکل (۴) یک Nanolوله نوع آرمچیر را در کتار واحد ساختاری آن شان می دهد که تحت تاثیر فشار هماهنگ از اطراف قرار می گیرد. یک سر لوله مقید است و این فشار خارجی می تواند لوله را خم کند. شکل (۴)(الف). هر واحد ساختاری با توجه به نوع هندسه آن دارای یک پیوند به طول a و دو پیوند به طول b ، یک زاویه α و دو زاویه β است.



شکل (۴): الف) نیروی وارد بر Nanolوله تک دیواره آرمچیر (ب) نیروی وارد بر واحد ساختاری آرمچیر

نیروی ناشی از این فشار خارجی به صورت شکل (۴ ب) به ساختار Nanolوله اعمال می شود. انرژی های جزء ساختاری لوله به صورت رابطه (۱) است:

$$U_{ra} = \frac{1}{2} k_r (da)^2 \quad (1)$$

$$U_{rb} = \frac{1}{2} k_r (db)^2$$

$$U_{\theta\alpha} = \frac{1}{2} k_\theta (d\alpha)^2 \quad (2)$$

$$U_{\theta\beta} = \frac{1}{2} k_\theta (d\beta)^2$$

که $k_r = 6/25 \times 10^{-7}$ و $k_\theta = 8/76 \times 10^{-11}$ در نظر گرفته شده - اند [۶]. اگر نیروهای وارد شده بر واحد ساختار لوله به دو مؤلفه در راستای پیوند و عمود بر پیوند تجزیه شوند، نیروهایی را که

ارتفاع این لوله همان عرض مستطیل گرافنی است که با توجه به اعداد n و m مشخص می شود.

$$T = t_1 \hat{a}_1 + t_2 \hat{a}_2$$

t_1 و t_2 اعداد صحیح هستند که با شرط عمود بودن بردار T برابردار C_h می توان مقدار آنها را بر حسب m, n محاسبه کرد.

$$\hat{C}_h \cdot \hat{T} = 0$$

$$(n \hat{a}_1 + m \hat{a}_2) \cdot (t_1 \hat{a}_1 + t_2 \hat{a}_2) = 0$$

$$\begin{cases} t_1 = (n+2m) \\ t_2 = -(2n+m) \end{cases}$$

اما از آنجا که T حداقل طول Nanolوله تک دیواره است، باید

کوچک ترین بردار T را در نظر گرفت.

پس:

$$t_1 = \frac{n+2m}{r}$$

$$t_2 = \frac{-(2n+m)}{r}$$

که r بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین $(n+2m)$ و $(2n+m)$ است.

Nanolوله با ثابت های (n,n) یک Nanolوله زیگزاگ و $(n,0)$ یک Nanolوله آرمچیر نامیده می شود.

۴- مدول یانگ

مدول یانگ جسم یا همان نسبت تنش به کرنش جسم نسبتی است که سفتی یک ماده با آن سنجیده می شود. برای یک ماده ویژگی های مکانیکی زیادی از جمله سختی، انعطاف پذیری، چکش خواری، استحکام و... تعریف می شود. از جمله این ویژگی ها سفتی جسم است که به عنوان خاصیتی از جسم تعریف می شود که به موجب آن جسم می تواند در برابر تغییر شکل مقاومت کند. مدول یانگ جسم اهمیت بسیاری در طراحی و ساخت قطعات مختلفی که از ماده ساخته می شود دارد. در کل یکی از ویژگی های اساسی ماده برای استفاده از آن در صنایع مختلف از جمله صنعت Nanotextures الکترونیکی است.

در مورد Nanolوله های کربن که نقش اساسی در صنایع الکترونیک آینده ایفا می کنند حفظ ساختار برای ثابت ماندن خواص رسانایی ماده عامل مهمی است. هر چه مدول یانگ یک ساختار بیشتر باشد آن ماده سفت تر است و مقاومت بیشتری در برابر تغییر شکل از خود نشان می دهد.

برای مطالعه خواص یک ساختار مهمترین موردهی که باید بررسی شود، نوع پتانسیل حاکم بین اتم ها در ساختار آن شبکه است. همه پتانسیل های پیوندی و غیرپیوندی حاکم بین اتم های کربن در Nanolوله عبارتند از:

$$U_{\theta\alpha} = \frac{f^2 b^2 \lambda_\alpha^2}{2k_\theta}$$

$$U_{\theta\beta} = \frac{f^2 b^2 \lambda_\beta^2}{2k_\theta}$$

در حالت کلی برای یک نانولوله (n,n) ، به تعداد n^2 واحد ساختاری وجود دارد که ز تعداد ردیفهایی است که از این واحدها در طول لوله چیده شده پس انرژی کل یک نانولوله که از زردیف این واحدها تشکیل شده است، برابر خواهد بود با:

$$U_{tot} = 2njU_{ra} + 4njU_{rb} + 2njU_{\theta\alpha} + 4njU_{\theta\beta} \quad (7)$$

از طرف دیگر با توجه به علم متالورژی مواد ، انرژی کرشم یک ساختار پیوسته استوانه ای تحت خمش به صورت زیر به دست می آید که عبارتند از:

$$U_c = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} dx$$

که M گشتاور خمشی است که در فاصله x از سر لوله وارد می شود، I گشتاور لختی سطح مقطع حول محور خنثای لوله، L طول لوله و E هم مدول یانگ این ساختار است. در اینجا چون یک استوانه جدار نازک وجود دارد که از ضخامت آن چشم پوشی می شود، از اثر نیروهای برشی چشم پوشی کرده و تنها تنش های عمودی را در نظر گرفته می شود. در پایان با جایگذاری $M=f x$ و $I=\pi R^4/2$ و $M=f x$ بدست $L=2j b \sin(\alpha/2)$ می آید:

$$U_c = \frac{2^4 f^2 (jb \sin(\alpha/2))^3}{6\pi R^4 E} \quad (8)$$

مدول یانگ یک نانولوله تکدیواره آرمچیر از برابر قرار دادن (7) و (8) به دست می آید.

$$E = \frac{8j^2 b^3 \sin^3(\alpha/2)}{3\pi R^4 n \left(\frac{1}{k_r} + \frac{2\cos^2(\alpha/2)}{k_r} + \frac{b^2 \lambda_\alpha^2}{k_\theta} + \frac{2b^2 \lambda_\beta^2}{k_\theta} \right)}$$

۴- نانولوله تک دیواره زیگزاگ

شکل (5) یک نانولوله تکدیواره زیگزاگ را در کنار واحد ساختاری آن نشان می دهد. واحد ساختاری زیگزاگ همانند آرمچیر از یک پیوند به طول a و دو پیوند به طول b ، یک زاویه α و دو زاویه β تشکیل شده است با این تقاضت که نسبت به آرمچیر به اندازه 90° درجه چرخیده است.

با علاوه کشش پیوندی و تغییر زاویه پیوندی می شود، به دست می دهد. در این صورت با استفاده از روابط تعادل نیروها و گشتاورها روابط (3) و (4) بدست می آیند:

$$\begin{aligned} f \cos(\alpha/2) &= k_r db \\ 2f &= k_r da \end{aligned} \quad (3)$$

(4)

$$f \sin(\alpha/2) \frac{b}{2} = k_\theta d\alpha + k_\theta d\beta \cos \varphi \quad \text{که } \varphi \text{ زاویه بین دو صفحه a-a و a-b است.}$$

$$\cos \phi = \frac{-\tan(\alpha/2)}{\tan(\beta)} \quad (5)$$

با جایگذاری da و db از روابط (3) در (1) انرژی های کشش پیوندی a و b به دست می آیند.

$$U_{ra} = \frac{f^2}{2k_r}$$

$$U_{rb} = \frac{f^2 \cos^2(\alpha/2)}{2k_r}$$

به علاوه از تقارن هندسی شکل (4) ب) بدست می آید:

$$\cos(\beta) = -\cos(\alpha/2) \cos(\pi/n)$$

و از آنجا

$$d\beta = \frac{-\sin(\alpha/2)}{2\sin(\beta)} \cos(\pi/n) d\alpha \quad (6)$$

که α/π زاویه شکست خط فرضی C-C در سطح مقطع لوله آرمچیر است.

با جایگذاری (5) و (6) در (4) به دست می آید:

$$d\alpha = \frac{fb}{k_\theta} \lambda_\alpha$$

که

$$\lambda_\alpha = \frac{\sin(\alpha/2) \sin(\beta) \tan(\beta)}{2\sin(\beta) \tan(\beta) + \sin(\alpha/2) \tan(\alpha/2) \cos(\pi/n)}$$

و از آنجا

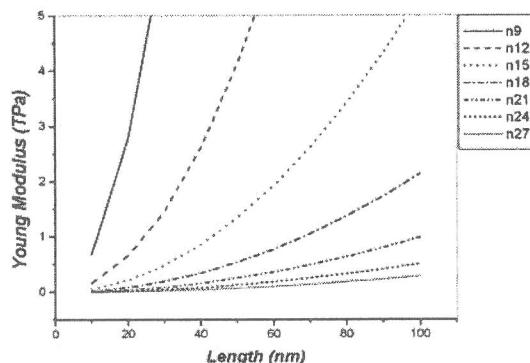
$$d\beta = \frac{fb}{k_\theta} \lambda_\beta$$

که

$$\lambda_\beta = \frac{-\sin(\alpha/2)}{2\sin(\beta)} \cos(\pi/n) \lambda_\alpha$$

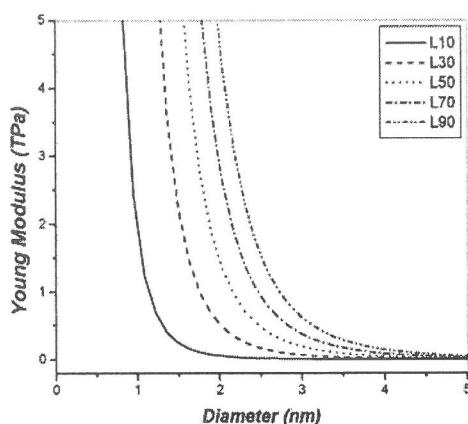
با جایگذاری $d\alpha$ و $d\beta$ در (2) انرژی های تغییر زاویه پیوندی هم محاسبه می شوند.

شکل (۶) نمودار تغییرات مدول یانگ نانولوله آرمچیر نسبت به طول آن را نشان می‌دهد و n مشخصه نانولوله است که در شکل مشخص شده است. بدینهی است با افزایش n قطر لوله زیاد می‌شود. از شکل می‌توان دریافت که با افزایش طول لوله مدول یانگ افزایش پیدا می‌کند اما با افزایش قطر لوله، کاهش پیدا می‌کند. برای لوله‌هایی که n آن‌ها از ۹ تا ۱۵ تغییر می‌کنند، قطر بین ۱ تا ۲ نانومتر دارند، مقدار مدول یانگ بیشتر است. دیده می‌شود که برای $n=24$ ، که قطر لوله از ۳ نانومتر بیشتر است، گستره‌ی تغییرات مدول یانگ نسبت به طول کم است یعنی در قطرهای بالاتر مقدار مدول یانگ تا اندازه‌ای ثابت می‌شود.

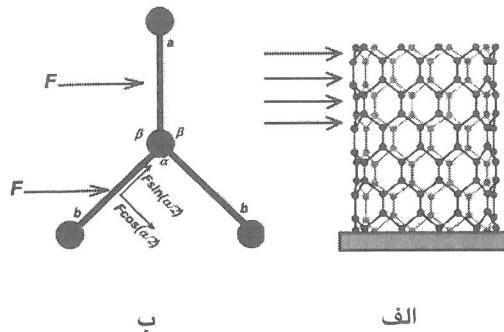


شکل (۶): تغییرات مدول یانگ نانولوله آرمچیر نسبت به طول

در شکل (۷) که تغییرات مدول یانگ نانولوله آرمچیر بر حسب قطر در طولهای متفاوت نشان داده شده، مشخص است که مدول یانگ نسبت به افزایش قطر یک روند نمایی کاهشی دارد. با افزایش قطر لوله، مدول یانگ کاهش پیدا می‌کند در حالی‌که با افزایش طول لوله، مدول یانگ افزایش پیدا می‌کند.



شکل (۷): تغییرات مدول یانگ نانولوله آرمچیر بر حسب قطر



شکل (۵): (الف) نیروی وارد بر نانولوله تک دیواره زیگزاگ (ب) نیروی وارد بر واحد ساختاری زیگزاگ

با نوشتن معادلات تعادل همانند حالت آرمچیر و با توجه به این که در این حالت زاویه شکست خط فرضی C-C در سطح مقطع لوله زیگزاگ، $\pi R^2/n$ است، انرژی پتانسیل مولکولی نانولوله زیگزاگ محاسبه خواهد شد:

$$U_{tot} = njU_{ra} + 2njU_{rb} + njU_{\theta\alpha} + 2njU_{\theta\beta} \quad (9)$$

که چون هیچ تغییر طولی در راستای پیوند a وجود ندارد، $U_{ra}=0$. مشخص لوله و زتعداد ردیفهای واحد ساختاری است که با توجه به طول لوله تعیین می‌شود. برای نانولوله زیگزاگ ($L=j(a+b\sin(\alpha/2))$) و انرژی کرنش آن از رابطه (۱۰) به دست می‌آید:

$$U_c = \frac{2f^2 j^3 (a+b\sin(\alpha/2))^3}{6\pi R^4 E} \quad (10)$$

در پایان با برابر قرار دادن (۹) و (۱۰) مدول یانگ نانولوله زیگزاگ همانند آرمچیر به دست می‌آید:

$$E = \frac{j^2 (a+b\sin(\alpha/2))^3}{3\pi R^4 n \left(\frac{\sin^2(\alpha/2)}{k_r} + \frac{b^2 \lambda_\alpha^2}{2k_\theta} + \frac{b^2 \lambda_\beta^2}{k_\theta} \right)}$$

۵- بحث

با توجه به فرآیندی که از معادلسازی انرژی در بخش‌های قبل توضیح داده شد، رفتار مکانیکی نانولوله کربنی در ناحیه الاستیک با بررسی مدول یانگ آن مورد مطالعه قرار گرفت. همانطور که یونگ وو و همکارانش [۱۰] با یک روش معادلسازی انرژی، مدول یانگ نانولوله را تحت فشار محوری نزدیک به 0.5 TPa محاسبه کردند که با افزایش شعاع لوله افزایش پیدا می‌کند، با کار انجام شده می‌توان بر این باور بود که این فشار خارجی نانولوله را تحت خمش قرار می‌دهد. حال بسته به این که نانولوله با چه طول و قطری تحت فشار قرار گیرد، نتایج به دست آمده برای مدول یانگ متفاوت خواهد بود.

روند کاهش تا قطرهای کمتر از یک نانومتر در طول ثابت زیاد است اما در قطرهای بیش از یک نانومتر کم است. همچنین دیده می‌شود که برای قطرهای بزرگتر از ۲ نانومتر در گستره‌ی طولی 10^{-6} نانومتر تغییر خیلی زیادی در مقادیر مدول یانگ دیده نمی‌شود در حالی‌که بیشترین تغییرات مدول یانگ در محدوده قطر $1/5$ –۱ نانومتر دیده می‌شود.

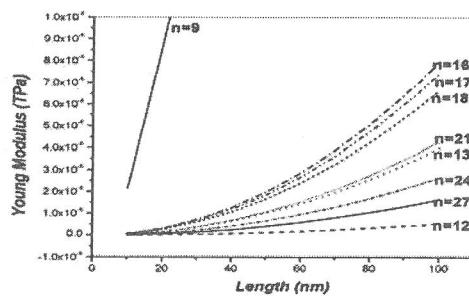
۶- نتیجه

زیرلایه بسیار تمیز سیلیکون را آمده کرده و اکسید سیلیکون فرا نازک بر این زیرلایه رشد داده شد. آنگاه به بررسی ویژگی فیلم اکسید فوق نازک پرداخته شد. در پی یافتن یک کanal مستحکم بوده تا هنگام قرارگیری در نانوترانزیستورهای اثرمیدانی، ساختار آن هنگام عبور حامل‌ها خیلی کم دستخوش تغییر شود.

نانولوله‌های آرمچیر با طول زیاد و شعاع کم مدول یانگ بیشتری دارند اما تغییرات مدول یانگ در شعاعهای کم به شدت حساس به تغییر قطر است. پس در صورتی که در نانوترانزیستور نیاز به قطر حوالی یک نانومتر و طول 10^{-6} نانومتر باشد، نوع آرمچیر که مدول یانگش هزاربرابر مدول یانگ زیگزاگ است، مناسب‌تر به نظر می‌رسد. همچنین به دلیل اینکه در قطرهای نزدیک به $5/2$ نانومتر نمودار مدول یانگ برحسب قطر نوع زیگزاگ تغییرات بیشتری دارد در صورتی‌که تغییرات نوع آرمچیر هموار است و از یک روند کلی نزولی پیروی می‌کند و چون تغییرات آن قابل پیش‌بینی بیشتری است، در آزمایش‌های تجربی خطای کمتری هم خواهد داشت. اما در گستره قطر بالای ۲ نانومتر، نانولوله زیگزاگ خیلی زیاد حساس به قطر نیست و با طول‌های مختلف در این گستره‌ی قطر، تغییرات مدول یانگش یک هزارم نوع آرمچیر است (گستره‌ی تغییرات نوع زیگزاگ در حد گیگاپاسکال است و نوع آرمچیر در حد تراپاسکال). البته از لحاظ مقدار هم یک هزارم نوع آرمچیر است اما باز هم مقدار بالایی دارد، پس نانولوله زیگزاگ هم می‌تواند گزینه خوبی در قطرهای بیشتر از ۳ نانومتر باشد. در حالت کلی با توجه به کارکرد نانولوله می‌توان تعیین کرد که از چه نوع نانولوله‌ای در نانوترانزیستورها باید استفاده کرد. نتیجه حاضر نشان می‌دهد که نانولوله تک دیواره آرمچیر با گستره قطر $2/5$ – $1/5$ نانومتر قابلیت آن را دارد تا به طور تجربی مطالعه شود و به عنوان کanal نانوترانزیستور به کار آید.

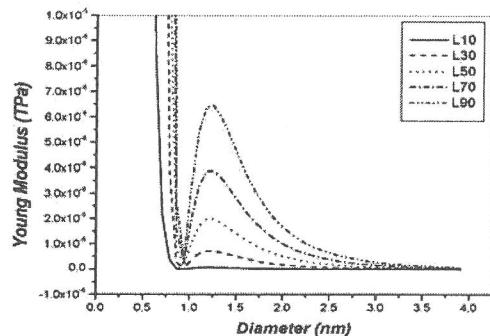
شاخص Δ در شکل نشان دهنده طول لوله برحسب نانومتر است. پس در این حالت نانولوله ای با شعاع کمتر و طول بیشتر مفیدتر خواهد بود اما باید به این نکته هم توجه کرد که در شعاعهای کم مدول یانگ به شدت به تغییر قطر حساس است و با تغییر کمی در قطر لوله، مدول یانگ آن تغییرات زیادی خواهد داشت.

برای نانولوله‌های تک دیواره زیگزاگ، تغییرات اساسی در قطرهای نزدیک به یک نانومتر رخ می‌دهد. طبق نمودار (۸) دیده می‌شود که برای نانولوله‌های زیگزاگ با $n=12$ که قطرشان کمتر از یک نانومتر است، با افزایش شعاع در طول ثابت، مدول یانگ کاهش پیدا می‌کند. سپس تا $n=16$ با افزایش شعاع در طول ثابت، مدول یانگ افزایش پیدا می‌کند. پس از $n=16$ هم، باز روند کاهش مدول یانگ با افزایش شعاع اتفاق می‌افتد.



شکل(۸): تغییرات مدول یانگ نانولوله زیگزاگ بر حسب طول در شکل (۸) دیده می‌شود که برای شعاعهای کمتر از یک نانومتر، تغییرات مدول یانگ خیلی زیاد است تا جایی که حتی گستره آن بطورکامل با گستره تغییرات مدول یانگ در شعاعهای بالای یک نانومتر تفاوت می‌کند.

در شکل (۹) که تغییرات مدول یانگ نانولوله زیگزاگ بر حسب قطر را نشان می‌دهد، با کاهش طول لوله زیگزاگ، مدول یانگ کاهش پیدا می‌کند.



شکل(۹): تغییرات مدول یانگ نانولوله زیگزاگ بر حسب قطر

۷-تقدیر و تشکر

طیف های سینکروترونی پیش تر بوسیله ای دکتر بهاری با راهنمایی پروفسور پر مورگن در دانشگاه آرهوس کشور دانمارک گرفته شده است و جا دارد از پروفسور پر مورگن

۸-مراجع

نهایت تقدیر و سپاس را داشته باشیم. بررسی طیف ها و کار نظری در گروه فیزیک دانشگاه مازندران صورت پذیرفته است.

Li, C.; Chou, T.; " A structural mechanics approach for the analysis of carbon nanotubes", International Journal of Solids and Structures, vol. 40, p.p. 2487-2499, 2003.

Pourfath, M.; Uengersboeck, E.; Gehring, A.; Cheong, B.H.; Park W.J.; Kosina, H.; Selberherr, S., "Optimization of Schottky barrier carbon nanotube field effect transistors", Microelectronic Engineering, vol. 81, p.p. 428-433, 2005.

Salvetat, J.P.; D. Briggs, G. A.; Bonard, J.M.; Bacsa , R.R.; Kulik, A.J.; Stöckli, T.; Burnham , N.A.; Forró , L., " Elastic and Shear Moduli of Single-Walled Carbon Nanotube Ropes", Physical Review Letters, vol.. 82, p.p. 944-947., 1999.

Wu, Y.; Zhang, X.; Leung, A.Y.T.; Zhong, W.; "An energy-equivalent model on studying the mechanical properties of single-walled carbon nanotubes"; Thin-Walled Structures, vol. 44, p.p. 667-676, 2006.

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

Bahari, A.; Morgen, P.; Padreson, K. ; Functional properties of Nanostructured Material (Vol.223 , 229-257); Springer (2006) , ISBN-13- 978-4020-4594-3 [۱]

Bahari, A., Morgen, P.; "Roads to ultrathin silicon oxides"; Journal of Vacuum Science and Technology A;vol.23,p.p.201-207 ,2005. [۲]

Bahari, A., Morgen, P., Pedersen, K. Li, Z.S ; "Growth of a stacked silicon nitride / silicon oxide dielectric on Si(100)" ;Journal of Vacuum Science & Technology B; Vol. 24, p.p. 2119-2123;2006. [۳]

Bahari, A., Morgen, P., Pedersen, K. Li, Z.S ; " Valence band studies of the formation of ultrathin pure silicon nitride films on Si(100)" , Surface Science, vol. 600, p.p.2966-2971, 2006. [۴]

Krishnan, a.; Dujardin, E.; Ebbesen, T. W.; Yianilos, P. N.; Treacy, M. M. J., " Young's modulus of single-walled nanotubes", Physical Review B, vol.58, p.p. 14013-14019, 1998. [۵]

Kalamkarov, A.L.; Georgiades, A.V.; Rokkam, S.K.; Veedu, V.P.; Ghasemi-Nejhad, M.N., "Analytical and numerical techniques to predict carbon nanotubes properties", International Journal of Solids and Structures, vol. 43, p.p. 6832-6854, 2006. [۶]